

РАЗРАБОТАН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. С. Боровиков, канд. техн. наук (руководитель темы); А. Г. Пеликан;  
В. П. Петров; Г. Г. Газизова; Т. И. Багрянцева; Е. А. Никитина

ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

Начальник Научно-технического управления Н. И. Гореликов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 ноября 1984 г.  
№ 4012

УДК 620.179.111.05 : 006.354

Группа П16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Контроль неразрушающий

ДЕФЕКТОСКОПЫ КАПИЛЛЯРНЫЕ

Общие технические требования  
и методы испытаний

Non-destructive testing. Capillary defectoscopes.  
General technical requirements and test methods

ОКП 42 7620

ГОСТ  
23349-84

Взамен  
ГОСТ 23349-78

с 01.01.86  
до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на капиллярные дефектоскопы (далее — дефектоскопы), предназначенные для выявления невидимых или слабо видимых глазом поверхностных несплошностей различного происхождения в металлических и неметаллических материалах, полуфабрикатах и изделиях любой геометрической формы.

Стандарт не распространяется на дефектоскопические материалы.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для дефектоскопов высшей и первой категорий качества.

1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Дефектоскопы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12.97-84 и технических условий на дефектоскопы конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Дефектоскопы должны изготавливаться в следующих конструктивных исполнениях: стационарные; передвижные; переносные.

1.3. Рабочие режимы дефектоскопов: длительный; кратковременный; повторно-кратковременный.

Издание официальное

Перечек на воспроизведен



© Издано 1180 стандартов, 1975

1.4. В зависимости от функционального назначения и эксплуатационной законченности дефектоскопы могут включать в себя полностью или частично следующие функциональные устройства подготовки объектов к контролю; обработки объектов дефектоскопическими материалами; проявления несплошностей; выявления несплошностей; контроля качества дефектоскопических материалов; контроля ультрафиолетового, видимого, теплового и других используемых излучений; контроля технологических процессов.

Схема условного обозначения капиллярных дефектоскопов приведена в рекомендуемом приложении 1.

1.5. Класс чувствительности контроля, достигаемый с помощью дефектоскопов и конкретных дефектоскопических материалов, — по ГОСТ 18442—80.

#### 1.6. Требования к конструкции

1.6.1. Конструкция дефектоскопов должна соответствовать эргономическим требованиям ГОСТ 22269—76 и ГОСТ 12.2.049—80.

1.6.2. В функциональных устройствах дефектоскопов, предназначенных для обработки объектов дефектоскопическими материалами, должна быть обеспечена герметизация и теплоизоляция.

1.6.3. Конструкцией дефектоскопов должна обеспечиваться защита от случайного прикасания к частям, находящимся под напряжением, в соответствии с ГОСТ 14254—80.

Требование распространяется на все рабочие положения дефектоскопа как при нормальной эксплуатации, так и после удаления крышек или частей, снимаемых без помощи инструмента, за исключением ламп с цоколем, имеющих защиту от случайного прикасания при установке и снятии лампы.

1.6.4. Допускаемые отклонения положений штативов, усилия смещения составных частей от зафиксированного положения и их устойчивость при наклонах должны быть установлены в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

1.6.5. Масса переносных дефектоскопов должна быть не более 10 кг.

1.6.6. Функциональные устройства дефектоскопов, предназначенные для контроля качества дефектоскопических материалов, обработки объектов дефектоскопическими материалами и контроля технологических процессов, должны быть устойчивы к коррозионному и окрашивающему воздействиям дефектоскопических материалов, воздействиям ультрафиолетового, видимого, теплового и других используемых излучений.

1.6.7. Время установления рабочего режима дефектоскопов должно быть не более 15 мин, а для изделий высшей категории качества — не более 10 мин.

1.7. Питание дефектоскопов следует осуществлять от сети переменного тока частотой  $(50 \pm 1)$  Гц при отклонениях напряжения сети в пределах от минус 15 до плюс 10% от nominalного значения.

Примечание. Допускается для дефектоскопов, в состав которых входят неспециализированные источники УФ-облучения, устанавливать отклонения напряжения питания в соответствии с техническими условиями на источники УФ-излучения конкретного типа.

1.8. Требования к электрической изоляции дефектоскопов — по ГОСТ 21657—83.

#### 1.9. Требования по устойчивости к внешним воздействиям

1.9.1. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха дефектоскопы должны изготавливаться по группам В3 и В4 ГОСТ 12997—84 и группам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Группа исполь- зования	Диапазон рабочей температуры воздуха при эксплуатации, °C (К)	Березное значение относительной влажности	Климатическое исполнение и кате- гории размещения по ГОСТ 16130—89
В5	плюс 15 (288) — плюс 40 (313)	80% при 35°C (308 K) и более низких темпера- турных без конденса- ции влаги	УЗ.1.4.2
В6	минус 10 (263) — плюс 35 (308)	80% при $(20 \pm 5)$ °C $(256 \pm 5)$ K	
Д4	минус 25 (148) — плюс 40 (313)	$(95 \pm 5)\%$ при $(25 \pm 5)$ °C $(256 \pm 5)$ K и более низ- ких температур без конденсации влаги	У1.1; У1; У2; У3

Примечание. Допускается изготавливать дефектоскопы, работающие в условиях термостатирования с температурой режимами в одном из двух основных температур и влажности, указанных в табл. 1.

1.9.2. Дефектоскопы должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.10. Требования к надежности — о ГОСТ 13216—74 и ГОСТ 27.003—83.

1.10.1. Для дефектоскопов должны быть установлены вероятность безотказной работы и средний срок службы, а с 01.07.86 — установленная безотказная наработка и установленный срок службы.

1.10.2. Вероятность безотказной работы дефектоскопов не должна быть менее 0,92 за 1000 ч, а для изделий высшей категории качества — 0,96 за 1000 ч.

Критерии отказов дефектоскопов должны быть указаны в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

1.10.3. Средний срок службы дефектоскопов не должен быть менее 10 лет.

1.10.4. Установленная безотказная наработка и установленный срок службы должны быть указаны в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

#### 1.11. Требования к составным частям

1.11.1. УФ-облучатели должны обеспечивать УФ-облученность в соответствии с ГОСТ 18442—80.

1.11.2. Размеры облучаемых полей стационарных дефектоскопов при визуальном контроле оператором сидя не должны быть менее 100×200 мм, стоя — менее 200×300 мм.

Отношение максимальной УФ-облученности к минимальной в пределах размера облучаемого поля должно быть не более 2.

1.11.3. В дефектоскопах, предназначенных для выявления неплоскостей, коэффициент мощности многоламповых УФ-облучателей должен быть не менее 0,85, одноламповых — не менее 0,8, для УФ-облучателей общей мощностью 300 Вт и менее — не нормируется.

**Примечание.** По согласованию с потребителем допускается изготовление УФ-облучателей с коэффициентом мощности менее указанных.

1.12. Комплектность дефектоскопов устанавливают в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

К дефектоскопам должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601—68.

1.13. В технических условиях на дефектоскопы следует также устанавливать:

область применения;

расстояние, на котором определяют УФ-облученность;

потребляемую мощность (энергоемкость);

габаритные размеры (объем);

массу (материалоемкость).

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Конструкция дефектоскопов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003—74.

2.2. В зоне действия дефектоскопов с источником УФ-излучения следует использовать средства индивидуальной защиты оператора — халаты с длинными рукавами и перчатки из темной нелюминесцирующей хлопчатобумажной ткани.

2.3. В УФ-облучателях дефектоскопов, предназначенных для люминесцентного метода с визуальным способом выявления дефектов, следует использовать в качестве источника УФ-излучения специализированные ртутные лампы в черных колбах, указанные в рекомендуемом приложении 2, а также неспециализированные ртутные лампы с приставными светофильтрами из стекла УФС6 и УФС8 по ГОСТ 9411—81.

**Примечание.** Допускается применение других источников и светофильтров, обеспечивающих выделение излучения с длиной волны 300—400 нм с преобладанием длины волны 365 нм. Излучение с длиной волны 300—320 нм допускается не более 10% от всего потока.

2.4. Дефектоскопы с источниками УФ-излучения должны быть снабжены встроенным или отдельным устройствами, защищающими лицо и глаза оператора от воздействия УФ-излучения. Требования к защитным устройствам устанавливают в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

2.5. Для индивидуальной защиты глаз следует применять защитные очки по ГОСТ 12.4.013—75:

закрытые с непрямой вентиляцией типа ЗН со светофильтрами из цветного оптического стекла марки ЖС4 по ГОСТ 9411—81 толщиной не менее 2 мм — при контроле объектов в условиях затмения при диффузно отраженном УФ-излучении;

закрытые с непрямой вентиляцией типа ЗН или ЗНР со светофильтрами С-4 — С-9 по ГОСТ 12.4.080—79 — при наладке УФ-облучателей.

#### Примечание:

1. При наличии зеркального отражения от контролируемого объекта и падении УФ-излучения более 3000 мкВт/см<sup>2</sup> средства индивидуальной защиты следует устанавливать в технической документации на контроль.

2. Допускается применение защитных очков со светофильтрами с аналогичной оптической плотностью, люминесценцией и спектральной характеристикой.

2.6. В качестве прозрачного пленочного негорючего материала, поглощающего УФ-излучение, но пропускающего видимый свет, следует применять полимерную пленку типа ПМ марки А по техническим условиям толщиной не менее 30 мкм.

2.7. Поверхности дефектоскопов, подвергаемые УФ-излучению, не должны эрозировать, коэффициент отражения УФ-излучения от поверхности дефектоскопов не должен быть более 0,2.

2.8. Максимально допускаемые значения дозы эритемного облучения и эритемной облученности в зоне работы оператора не должны превышать указанных в табл. 2.

Таблица 2

Типы источников УФ-излучения	Максимально допускаемая доза зрителного облучения, мэр·ч/м <sup>2</sup>	Продолжительность непрерывной работы за рабочую смену, ч	Максимально допускаемая зрителная облученность, мэр/м <sup>2</sup>
Специализированные ртутные лампы в черных колбах	160	8,0	20
		3,0	50
		1,5	100
Неспециализированные лампы с приставными фильтрами	560	8,0	От 16 до 65
		3,5	150
		2,0	280

2.9. При работе со стационарными дефектоскопами, предназначенными для использования цветного и ахроматического методов с визуальным способом выявления несплошностей, следует применять комбинированное освещение (общее и местное).

Освещенность контролируемой поверхности — по ГОСТ 18442—80.

Конкретные значения освещенности должны быть указаны в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

Значение яркости контролируемой поверхности в направлении глаз оператора не должно превышать 400 кд/м<sup>2</sup>.

2.10. В составных частях дефектоскопов, предназначенных для использования со вспомогательными средствами осмотра (например, лупами, бинокулярными операционными микроскопами, зеркалами), должна быть обеспечена освещенность объекта, соответствующая требованиям эксплуатации этих средств.

2.11. Вентиляция в помещении для стационарных дефектоскопов, содержащих УФ-облучатели с неспециализированными ртутными лампами, являющимися источниками озона, должна обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.1.005—76.

2.12. В дефектоскопах, при работе которых в воздух выделяются пыль и пары вредных веществ, должны быть предусмотрены встроенные отсосы, вентиляция, очистка и регенерация технологических выбросов и стоков.

2.13. Скорость воздуха в рабочем проеме дефектоскопа (средняя по периметру рабочего сечения) при работе с дефектоскопами материалами должна быть указана в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

2.14. Предельно допускаемые значения температуры частей дефектоскопов, с которыми соприкасается оператор при работе, не должны быть выше:

40°C (313 K) — для составных частей, выполненных из металла;

45°C (323 K) — для составных частей, выполненных из материалов с низкой теплопроводностью.

Значения температуры остальных составных частей устанавливают в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

2.15. Символы органов управления дефектоскопов — по ГОСТ 12.4.040—78.

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Проверку дефектоскопов на соответствие требованиям пп. 1.1, 1.9.1 и 1.9.2 проводят по разд. 5 ГОСТ 12997—84 и методам, установленным в технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

Допускается проверять дефектоскопы на соответствие требованиям пп. 1.9.1 и 1.9.2 испытанием отдельных блоков функциональных устройств, если результаты их испытаний могут характеризовать дефектоскоп в целом.

3.2. Проверку класса чувствительности (п. 1.5) проводят визуальной оценкой выявляемости несплошностей на стандартных образцах предприятия, приведенных в рекомендуемом приложении 3, с соблюдением требований пп. 1.11.1—1.11.3, 2.3, 2.7 и 2.9.

3.3. Проверка на соответствие требованиям п. 1.8 — по ГОСТ 21657—83.

3.4. Проверка УФ-облученности (пп. 1.11.1—1.11.3; 2.8) — по ГОСТ 18442—80 и разд. 3 «Гигиенических требований к конструкции и эксплуатации установок с искусственными источниками ультрафиолетового излучения для люминесцентного контроля качества промышленных изделий» № 1854—78, утвержденных Минздравом СССР. Допускается применение поверенных уфиметров различных типов.

3.5. Испытания дефектоскопов на надежность (пп. 1.10.1—1.10.3) — по ГОСТ 13216—74 и ГОСТ 20699—75.

Испытание дефектоскопов на надежность (п. 1.10.4) — по техническим условиям на дефектоскопы конкретного типа.

3.6. Методы проверки дефектоскопов на соответствие требованиям пп. 1.2—1.4; 1.6.1—1.6.7; 1.12; 1.13; 2.1; 2.4; 2.12—2.15 — по техническим условиям на дефектоскопы конкретного типа.

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**  
Рекомендуемое

**Схема условного обозначения капиллярных дефектоскопов**



Пример условного обозначения переносного капиллярного дефектоскопа с функциональными устройствами проявления и выявления несплошностей, используя цветной метод контроля:

КД-34-3-Ц

Пример условного обозначения стационарного капиллярного дефектоскопа, использующего люминесцентный метод, с функциональными устройствами обработки объектов дефектоскопическими материалами, выявления несплошностей (УФ-облученность — 50 отн. ед.) и контроля технологических процессов:

КД-247-1-Л-50

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
Рекомендуемое

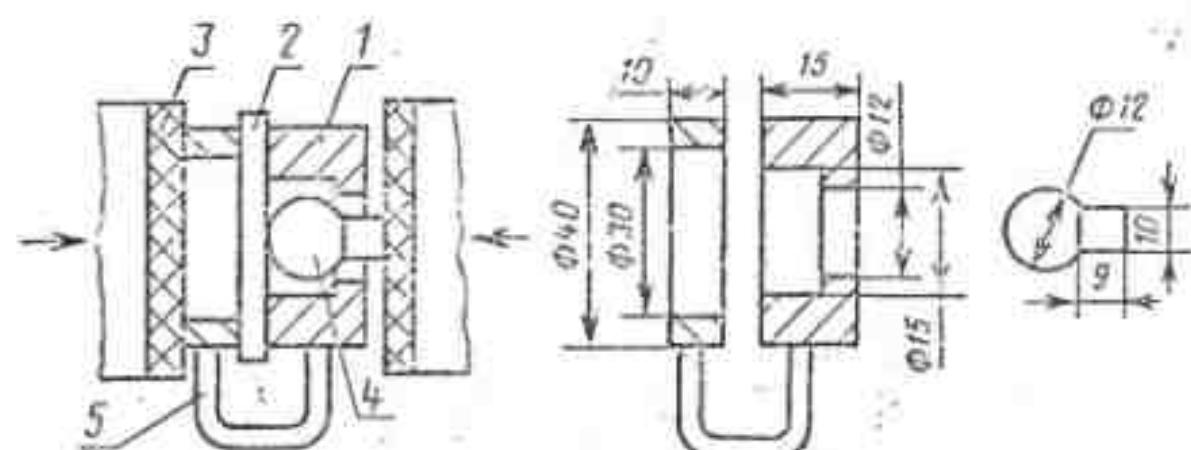
**Типы специализированных ртутных ламп**

ДРУФ-125, ДРУФ-125 по ТУ 16-545-056-80; ДРУФ-125-1, ДРУФ-250 по ТПО.339.836.ТУ; ЛУФ-4-1 по ТУ 16-545-057-75.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
Рекомендуемое

**Образец № 1**

1. Образец изготавливают размерами 30×70×3 мм из листовой стали ЭИ-962 IX12Н2ВМФ по техническим условиям. Допускается применение азотированной стали.
2. Полученную заготовку рихтуют и шлифуют на глубину 0,1 мм с одной рабочей стороны.
3. Заготовку азотируют на глубину 0,3 мм без последующей закалки.
4. Рабочую сторону шлифуют на глубину 0,02—0,05 мм. Параметр шероховатости поверхности  $R_a \leq 0,40$  мкм по ГОСТ 2789-73.
5. Образец помещают в приспособление (черт. 1).



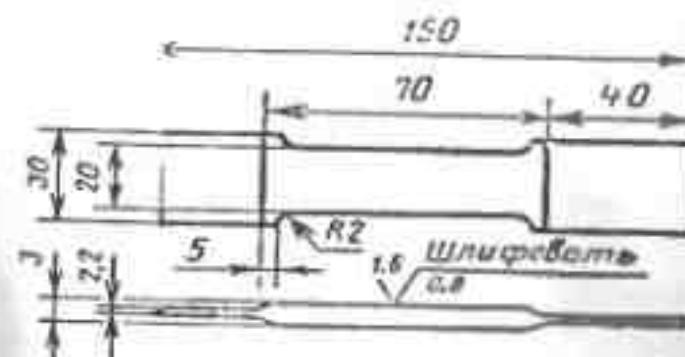
1—приспособление; 2—тест-образец; 3—тиски; 4—рукоятка; 5—скоба

Черт. 1

6. Приспособление устанавливают в тиски как показано на черт. 1 и плавно зажимают до появления характерного хруста азотированного слоя.
7. Ширину трещин измеряют на металлографическом микроскопе.

**Образец № 2**

изготавливают толщиной 4 мм из листов стали ЭИ-962  
по техническим условиям.  
технические размеры образца приведены на черт. 2.



Черт. 2

рихнут и шлифуют с двух сторон на глубину 0,1 мм,  
на глубину 0,3—0,4 мм,  
с одной стороны (рабочей) на глубину 0,05—0,1 мм с обильной  
охлаждающей жидкостью. Параметр шероховатости поверхности —  $R_a \leq 0,80$  мкм  
по ГОСТ 2789—73.  
Лиши на все длине шлифуют с двух сторон о полного удаления.  
шлифуют в борьбовой машине с предельной нагрузкой 98·400 Н  
и нагрузкой с появления характерного хруста.  
загружают опытным путем в зависимости от толщины  
изменяя на металлографическом микроскопе.

**Образец № 3**

готавливают цилиндрической формы (длина 250—300 мм, диаметр У-10 по ГОСТ 1435—74 (допускается изготовление из алюминия).  
изготавливают до твердости HRC 60...63.  
ную поверхность шлифуют. Параметр шероховатости по поверхности —  $R_a \leq 0,80$  мкм по ГОСТ 2789—73.  
чески наносят слой хрома толщиной 0,25—0,31 мм.  
на глубину 0,1 мм твердым (Т или СТ) абразивным кирпичом  
при попечении подаче 0,03—0,05 мм на один двойной ход и  
лине свыше 1—3 м/мин.  
изрезают пилой на две части.  
ции измеряют на металлографическом микроскопе.

**Образец № 4**

готавливают в виде дисков толщиной 4 мм и диаметром 50 мм из ВТЗ-1 (допускается готовить из сплавов 5—1).  
ную поверхность шлифуют с двух сторон на глубину 0,2 мм. Параметр шероховатости —  $R_a \leq 0,80$  мкм по ГОСТ 2789—73.  
гружают на воздухе, разжигая в течение 2 ч температуру  
и затем охлаждают до комнатной температуры.

4. Заготовку помещают в кольце (внешний диаметр 50 мм, внутренний — 30 мм) в нагрузку от шарика на прессе Бринелля, создающем нагрузку 15000 Н (1530 кгс).

5. Образец греют в течение 3 ч на воздухе при температуре 350°C (623 K).
6. Ширину трещин измеряют на металлографическом микроскопе.

**Образец № 5**

1. Образец изготавливают размерами 70×35×4 мм из полосовой инструментальной стали У-10 по ГОСТ 1405—75.

2. Шлифуют на глубину 0,2 мм с обильным количеством охлаждающей жидкости с обеих сторон. Параметр шероховатости поверхности —  $R_a \leq 0,80$  мкм по ГОСТ 2789—73.

3. На всю шлифованную поверхность электролитически наносят слой хрома толщиной 0,3 мм.

4. Для получения трещин образец выдерживают в течение 1 ч при температуре 250°C (523 K).

5. Ширину трещин измеряют на металлографическом микроскопе.

**Образец № 6**

1. Образец представляет собой объект контроля или его часть с естественными дефектами.

2. Ширину трещин измеряют на металлографическом микроскопе.